



RSF Elektronik
Ges.m.b.H.

Elektronische Längen- und
Winkelmessgeräte,
Kabelsysteme, Präzisionsteilungen

MICROS Optics test panel for SCRATCHES AND DIGS according to American standards; item 10207

Checking of the applied photolithographic structures

Test feature: Length and width of the structure in the case of scratches. Diameter for digs

1. Scratches (units in mm)

Feld											
5				10				20			
Soll		Ist		Soll		Ist		Soll		Ist	
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,005	16	0,0050	16,0013	0,01	16	0,0099	16,0009	0,02	16	0,0200	16,0004

Feld											
40				60				80			
Soll		Ist		Soll		Ist		Soll		Ist	
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,04	16	0,0403	16,0004	0,06	16	0,0602	16,0001	0,08	16	0,0799	15,9996

Feld					
120					
Soll			Ist		
Breite	Länge		Breite	Länge	
0,12	16		0,1198	15,9993	

2. Digs (units in mm)

Feld											
5		10		20		30		40		50	
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
0,05	0,0499	0,10	0,1002	0,20	0,1998	0,30	0,3000	0,40	0,3999	0,50	0,4999

Feld					
70			100		
Soll	Ist		Soll	Ist	
Ø	Ø		Ø	Ø	
0,70	0,7002		1,00	1,0000	